

電気特性試験

試験法	対応規格	評価項目
抵抗特性試験 【二重リング電極法】	JIS K6271-1 ASTM D257 等	半導体～絶縁体領域 ($10^1 \sim 10^{16} \Omega$) の材料における電流の流れにくさ(電気抵抗)を評価
抵抗特性試験 【平行端子電極法】	SRIS 2301 ASTM D991 等	半導体領域 ($10^{-1} \sim 10^8 \Omega$) の材料における電流の流れにくさ(電気抵抗)を評価
抵抗特性試験 【4探針電極法】	JIS K7194	導体～半導体領域 ($10^{-3} \sim 10^7 \Omega$) の材料における電流の流れにくさ(電気抵抗)を評価
絶縁破壊試験	JIS C2110 ASTM D149 等	高電圧下における絶縁材料の耐久性を評価(絶縁破壊強さ、耐電圧)
アーク放電劣化試験	JIS C2135 ASTM D495	材料表面近傍での高電圧微小電流アークによる損傷に対する耐久性を評価
トラッキング劣化試験	JIS C2134 ASTM D3638 等	材料表面近傍での繰り返し微小放電に伴う炭化導電路形成による損傷(トラッキング)に対する耐久性を評価
誘電特性試験	JIS C2138 ASTM D150	誘電材料の誘電特性を評価(誘電率及び誘電正接)
帯電電荷減衰度測定 【半減期測定法】	JIS L1094 A法	材料の静電気減衰特性を評価(帯電性、静電気の逃げやすさ)
摩擦帯電圧測定	JIS L1094 B法	2つの材料を摩擦したときの静電気電位を評価(静電気の溜まりやすさ)

上記以外の規格試験やオーダーメイド試験にも対応可能です
まずはお気軽にご相談ください



一般財団法人 化学物質評価研究機構
Chemicals Evaluation and Research Institute, Japan

■大阪事業所 大阪府東大阪市荒本北1-5-55
TEL.06-6744-2022/FAX 06-6744-2052

URL

<https://www.cerij.or.jp>